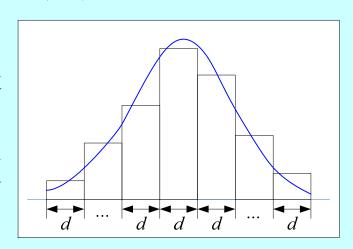
§ 4 直方图

——总体分布的估计和检验

- (一)等距频率直方图
 - ——密度函数的图解法
 - (1) 说明1
 - 直方图: 在平面坐标上,以x轴表示所考察的数据变量,以y轴表示某统计量。以每组数据的区间为底边,以统计量为高画长方形,可得出数据的直方图。
 - 等距: 每个区间距离相等
 - 频率直方图:长方形的面积表示落入此区间的频率
 - 主要作用:对总体分布的密度 函数进行估计。



- (2) 原理

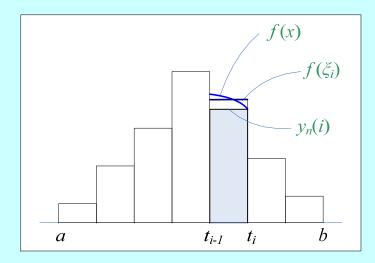
- 设 $X_1, X_2, ..., X_n$ 是来自分布密度函数的f(x)某总体X的样本(假设X是连续型随机变量),
- 把X的取值范围等分为m个小区间,每个区间长度为d,
- 落入第 i 个小区间 $[t_{i-1}, t_i)$ (i=1,2,...,m) 的观测个数为 μ_i ,
- 观测值落入第i个小区间的概率为

$$p_{i} = P\{t_{i-1} \le X < t_{i}\} = \int_{t_{i-1}}^{t_{i}} f(x) dx$$
$$= (t_{i} - t_{i-1}) f(\xi_{i}) , \quad \xi_{i} \in [t_{i-1}, t_{i})$$

• 用频率作为概率的估计:

$$p_i = (t_i - t_{i-1}) f(\xi_i) \approx \frac{\mu_i}{n}$$

• 故可得 $f(\xi_i)$ 的估计值 $y_n(i)$:



$$f(\xi_i) \approx \frac{\mu_i}{n(t_i - t_{i-1})} = \frac{\mu_i}{nd} @y_n(i)$$

- 当 f(x)在 $[t_{i-1}, t_i)$ 上连续,d 很小且样本量 n 充分大时,则可用 $y_n(i)$ 作为 f(x) 在小区间 $[t_{i-1}, t_i)$ 上的近似值。
- •结论:可通过等距频率直方图估计分布密度函数的情况。

- (3) 作频率直方图的步骤

假设一组实验数据为: $x_1, x_2, ..., x_n$,

- ①确定区间端点,分组数,组距
 - 1> 区间端点 [a,b]

设
$$x_{(1)} = \min_{i} \{x_i\}, \quad x_{(n)} = \max_{i} \{x_i\}$$
 则取 $a = x_{(1)} - \varepsilon, \quad b = x_{(n)} + \varepsilon$

 ε 可根据实验数据的有效数字来决定(如 x_i 取小数点后2位数字,则可取 ε =0.005)

2> 分组数*m*

由样本容量n决定,通常取值为 $m=1.87\times(n-1)^{-5}$

3〉组距d d = (b-a)/m

- ②计算分组频数和频率
 - 1>确定每个小区间的端点

求出把区间[a,b] 等分成 m 个小区间的 m-1个分点:

$$t_1 < t_2 < \ldots < t_{m-1},$$

记 $t_0=a$, $t_m=b$,第i个小区间为[t_{i-1} , t_i), $t_i=a+id$ 。

2>求 $[t_{i-1},t_i)$ 上的经验频数 μ_i

计算满足不等式 $t_{i-1} \le x_j < t_i$ (j = 1, 2, ..., n; i = 1, 2, ..., m)

的数据 $\{x_i\}$ 的个数 μ_i ,

依次扫描 $x_1, x_2, ..., x_n$,对于每个 x_j , $i = \begin{vmatrix} x_j - a \\ d \end{vmatrix} + 1$

 $\mu_i = \mu_i + 1$ (μ_i 初值=0)。

3>求 $[t_{i-1},t_i)$ 上的经验频率 f_i

$$f_i = \frac{\mu_i}{n}$$
 (*i* = 1, 2, ..., *m*)

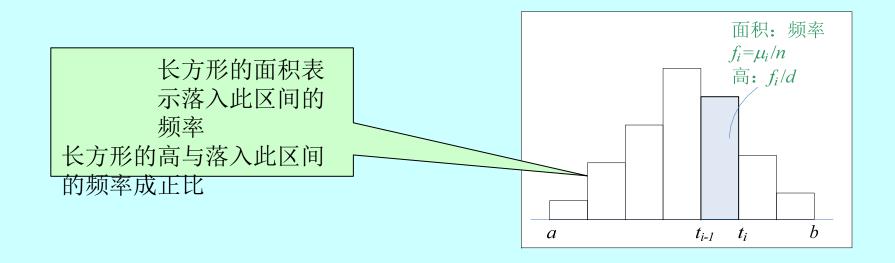
• ③画频率直方图

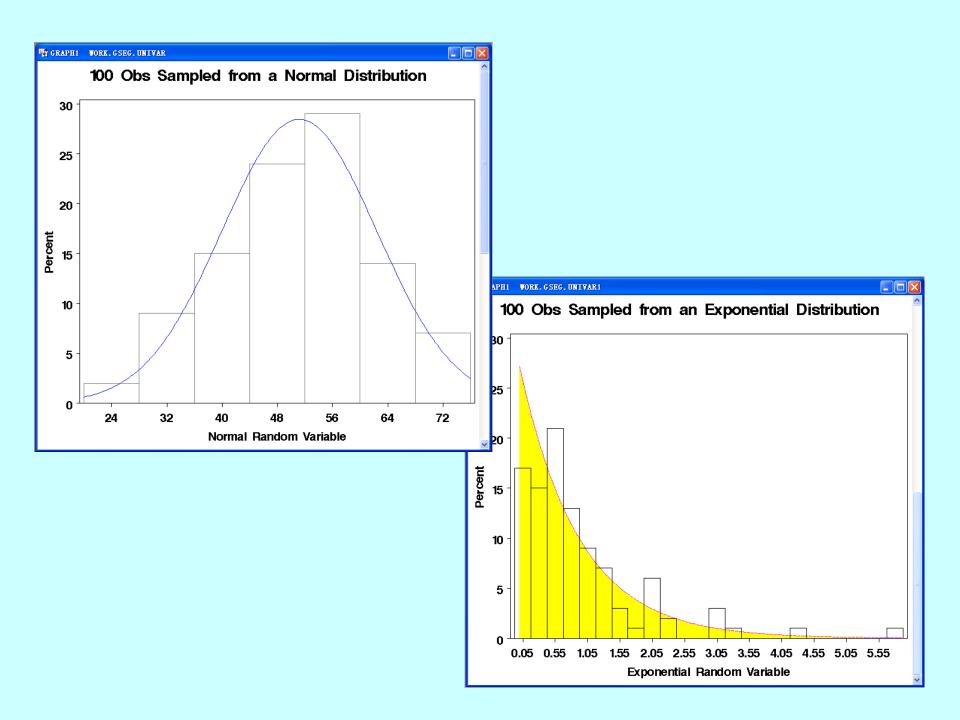
对每个小区间[t_{i-1} , t_i) (i=1,2,...,m)分别作长方形(面积为 f_i):

以小区间 $[t_{i-1}, t_i)$ 长度为底,

以 $y_i = f_i / d$ 为高,

画出一排竖着的长方形即为频率直方图。





- (4) 方法说明
 - (用直方图估计总体时)
 - ①分布的拟合检验
 - 1>问题:检验总体是否服从于某种确定分布函数 $F_0(x)$ 。
 - 2> 方法: 分布的 2 拟合优度检验法
 - 3> 理论回顾:

假设检验问题:

$$H_0: F(x) = F_0(x), \quad H_1: F(x) \neq F_0(x)$$

对于连续型随机变量:

$$H_0: f(x) = f_0(x), \quad H_1: f(x) \neq f_0(x)$$

思想:

把样本空间 S 分成 m 个互不相交的集合 ($A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m = S$, $A_i A_j = \emptyset$, $i \neq j$, $i, j = 1, 2, \ldots, m$) 在假设 H_0 下,可以算出 $p_i = P(A_i)$, $i = 1, 2, \ldots, m$ 又可统计出n次试验中, A_i 出现的频数 μ_i ,一般地,若 H_0 为真,且n充分大时, μ_i 与 np_i 的差异不会显著。皮尔逊定理:若n充分大,如下统计量 χ^2 总是近似的服从自由度为(m-r-1)的 χ^2 分布,

$$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{m} \frac{(\mu_{i} - np_{i})^{2}}{np_{i}} = \sum_{i=1}^{m} (\frac{\mu_{i}}{n} - p_{i})^{2} \frac{n}{p_{i}}$$

其中r是 $F_0(x)$ 中被估计参数的个数。

• 4> 在频率直方图中的应用

对于连续型随机变量,

零假设 H_0 : 总体的分布密度函数为 $f_0(x)$ 。

把取值范围划分为有限个互不重叠的子区间 $[t_{i-1}, t_i)$ i=1,2,...,m

统计出样本中随机变量落在每个子区间的频数 μ_i (i=1,2,...,m),

在假设 H_0 下,求观测值落入第 i 个小区间 $[t_{i-1}, t_i)$ (i=1,2,...,m) 的概率:

 $p_{i} = \int_{t_{i-1}}^{t_{i}} f_{0}(x) dx$

并求出统计量22的估计值:

$$\hat{\chi}^2 = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\mu_i}{n} - p_i\right)^2 \frac{n}{p_i}$$

当 p_i 很小时,若出现个别小区间经验频数 μ_i 与理论频数 np_i 相差较大的情况,将会使 χ^2 的估计值增大很多,从而拒绝零假设。

- ②直方图分组数m 的选取
- 1>选取原则:

分组数 m 较大时能更好的反应样本的情况 使得每个小区间的频数 $\mu_i \neq 0$,最好 $\mu_i \geq 5$ (i=1,2,...,m),当某 $\mu_i < 5$ 时,可把小频数区间与相邻区间合并,即调整分组数 m 。

2>相关因素: 样本容量、实验数据的取值范围、有效数字的位数

当n大时,m也相应取较大的数;

当 x_i 的有效数字的位数较多且取值范围大时,m也相应取较大的数。

例: 若只考虑m和n的关系,当总体服从于正态分布,m与n的最优拟合关系:

$$m = 1.87 \times (n-1)^{\frac{2}{5}}$$

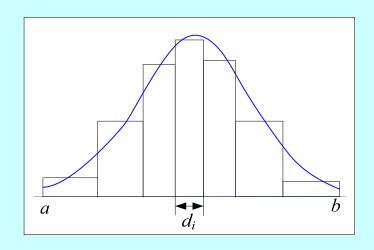
例:进一步考虑 x_i 的取值范围,若

$$x_{(n)}$$
 - $x_{(1)}$ = 11.6-10.2=1.4

且数据的有效位数是小数点后一位,

为保证不出现频数为0的小区间,应取 m \leq 14。

- (二)等概频率直方图——分布的拟合检验
 - (1) 说明1
 - 等概: 数据落入每个区间的概率相等
 - 频率直方图:长方形的面积表示数据落入每个区间的频率
 - 作用: 进行分布的拟合检验



- (2) 作图

- 设实验数据 $x_1, x_2, ..., x_n$ 来自总体 X,其分布函数F(x)已 知,数据的取值范围是[a,b]。
- 记 t_0 =a, t_m =b, 计算m-1个分点 t_i (i=1,2,..., m-1)的位置

$$P\{t_{i-1} \le X < t_i\} = p_i = \frac{1}{m}$$

这些分点将[a,b]分成互不相交的m个等概率区间。

- 以下步骤同绘制等距频率直方图
 - ①确定区间端点[a,b],分组数m,组距 d_i (已完成)
 - ②计算分组频数 μ_i 和频率 $f_i = \mu_i / n$
 - ③画等概频率直方图

以小区间 $[t_{i-1}, t_i)$ 长度为底, $y_i = f_i / d_i$ 为高, 画出一排竖着的长方形.

- (3) 作用:可对样本是否来自总体分布为已知的密度函数 $f_0(x)$ 进行拟合检验。
 - 零假设 H_0 : 总体的分布密度函数 $f(x) = f_0(x)$ 。
 - 等价形式 H_0 : $p_i = \frac{1}{m} (i = 1, 2, ..., m)$, 其中 $p_i = P\{t_{i-1} \le X < t_i\}$

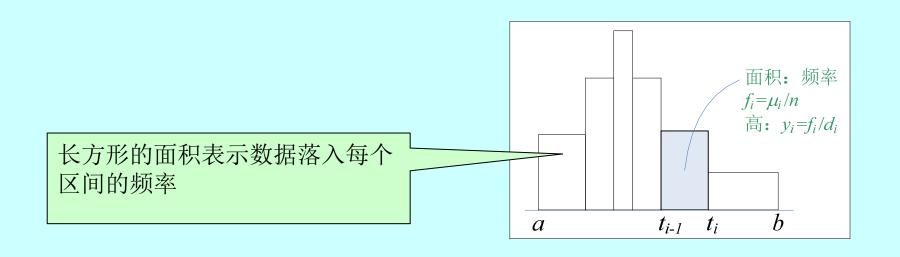
- 区间分点 t_i 满足 $p_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} f_0(x) dx = \frac{1}{m}$
- 取统计量

$$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\mu_{i}}{n} - p_{i}\right)^{2} \frac{n}{p_{i}} = \sum_{i=1}^{m} \frac{(\mu_{i} - np_{i})^{2}}{np_{i}}$$

• 在上述 H_0 成立时,统计量

$$V \otimes \sum_{i=1}^{m} \frac{(\mu_{i} - n/m)^{2}}{n/m}$$

近似服从于m-1个自由度的 χ^2 分布,利用统计量V可以检验总体是否来自己知分布 $f_0(x)$ 。

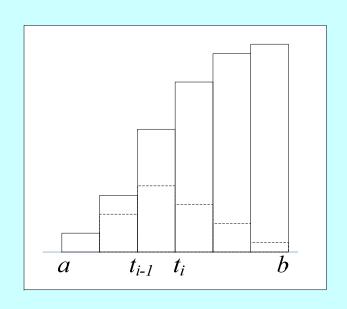


- (三)累计频率直方图——分布函数的图解法
 - (1) 作用:累计频率直方图可用来描述样本经验分布函数 $F_n(x)$, $F_n(x)$ 可用来近似分布函数 F(x)。
 - (2) 作图:
 - 已知实验数据 $x_1, x_2, ..., x_n$,区间端点[a,b],分组数 m,组距 d 的求法同频率直方图。
 - 第i个小区间 [t_{i-1} , t_i) 的频数为 μ_i (i=1,2,...,m),

累积频数为
$$v_i = \sum_{j=1}^i \mu_j$$
 , $(i=1,2,...,m)$

累积频率为 $g_i=v_i/n$ (i=1,2,...,m)

• 画直方图 对每个小区间 $[t_{i-1}, t_i)$ (i=1,2,...,m) 分别作长方形: 以小区间 $[t_{i-1}, t_i)$ 长度为底, 以 $y_i = g_i / d$ 为高, 画出一排竖着的长方形即为累计频率直方图。



§ 5 正态性检验

- 正态性检验: 检验某随机变量是否服从正态分布。 即检验观测数据与正态总体差异是否显著。
- -问题:设 $X_1, X_2, ..., X_n$ 是来自总体X的样本,我们要检验

 H_0 : 总体X的分布是正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

- 1. *x*² 检验法
 - 方法:
 - 用 m 个点 ($t_1 < t_2 < ... < t_m$) 把实轴分成 m+1 段,分别为:

$$(-\infty, t_1), [t_1, t_2), ..., (t_m, \infty),$$

• 用 μ_i 表示观测数据落入第 i 段(i=1,2,...,m)的频数,

 μ_i/n 表示频率,

• 用 p_i 表示样本来自正态分布总体时落入第i段的概率,即

$$p_{1} = P\{X < t_{1}\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}}} \int_{-\infty}^{t_{1}} e^{-\frac{(x-\mu)^{2}}{2\sigma^{2}}} dx$$

$$p_{i} = P\{t_{i-1} \le X < t_{i}\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}}} \int_{t_{i-1}}^{t_{i}} e^{-\frac{(x-\mu)^{2}}{2\sigma^{2}}} dx$$

$$(i = 2, ..., m)$$

$$p_{m+1} = P\{X \ge t_{m}\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^{2}}} \int_{t_{m}}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^{2}}{2\sigma^{2}}} dx$$

• 当假设成立而且 n 充分大(n >30) 时, 计算统计量

$$V = \sum_{i=1}^{m+1} \left(\frac{\mu_i}{n} - p_i\right)^2 \frac{n}{p_i} = \sum_{i=1}^{m+1} \frac{(\mu_i - np_i)^2}{np_i}$$

统计量 V 是随机变量,当 n 充分大时近似的服从 χ^2 (m) 分布。注意:在实际应用中,一般正态分布总体的参数 μ , σ^2 未知,需要先求参数: \overline{x} , s^2 分别作为 μ , σ^2 的估计值;再进行 χ^2 检验,这时统计量 V 近似的服从 χ^2 (m-2) 分布。

- 求出满足 $P\{V > \lambda \mid H_0\} = \alpha$ 的 λ , 其中 α 是显著水平,
- 若 $V > \lambda$ 就拒绝 H_0 ,否则接受 H_0 。

-2. 偏峰检验法

• 原理

设正态随机变量X的偏度为 g_1 ,峰度为 g_2 :

$$g_1 = \frac{E(X - E(X))^3}{\sigma^3}, \quad g_2 = \frac{E(X - E(X))^4}{\sigma^4} - 3$$

则 g_1 =0, g_2 =0。

根据样本数据可计算出偏度和峰度的估计量:

$$G_{1} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{3}}{s^{3}}, \quad G_{2} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{4}}{s^{4}} - 3$$

$$(s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{2}})$$

可以证明,当总体服从于正态分布且样本容量相当大(n >30)时,统计量 G_1 和 G_2 近似正态分布,且有

$$E(G_1) \approx 0$$
, $Var(G_1) \approx 6/n$;
 $E(G_2) \approx 0$, $Var(G_2) \approx 24/n$

• 实现:

取检验水平 $\alpha = 0.05$

由样本值计算统计量 G_1 和 G_2

判断: 如果以下不等式

$$-2\sqrt{\frac{6}{n}} \le G_1 \le 2\sqrt{\frac{6}{n}}$$

$$-2\sqrt{\frac{24}{n}} \le G_2 \le 2\sqrt{\frac{24}{n}}$$

有一个不成立,就拒绝 H_0 ,认为总体不服从正态分布;如果不等式均成立,就不能否认总体服从正态分布。

• 3. Q-Q图检验法

分位数-分位数(Quantile-Quantile)图

- **–** (**1**)原理
 - 将观测数据从小到大排列,得次序统计量:

$$x_{(1)} \leqslant x_{(2)} \leqslant \ldots \leqslant x_{(n)},$$

• 则经验分布函数为:

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & \stackrel{\text{de}}{=} x < x_{(1)} \\ \frac{k}{n}, & \stackrel{\text{de}}{=} x_{(k)} \le x < x_{(k+1)} & k = 1, ..., n-1 \\ 1, & \stackrel{\text{de}}{=} x \ge x_{(n)} \end{cases}$$

• 对于正态分布总体,分布函数近似等于样本经验分布函数,即

$$F(x) = P\{X < x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$
$$= \Phi(\frac{x-\mu}{\sigma}) \approx F_n(x)$$
$$\frac{x-\mu}{\sigma} = \Phi^{-1}(F_n(x)) @u$$

故有

从而

$$x = \sigma u + \mu$$

在Oux平面上,表示斜率为 σ ,截距为 μ 的直线。

• 根据样本数据在在 Oux 平面上画点集 $(u_i, x_{(i)})(i=1,2,...,n)$,其中

$$u_i = \Phi^{-1}(F_n(x_{(i)}))$$

• 当 $x = x_{(i)}$ 时, $x_{(i)}$ 是经验分布函数的样本分位点 经验分布函数 $F_n(x_{(i)}) = \frac{i}{n}$

实际应用中,常用 $F_n(x_{(i)}) = \frac{i-0.5}{n}$ (作"连续性"修正)

- 相应的 $u_i = \Phi^{-1}(\frac{i-0.5}{n})$,是标准正态分布函数的 $\frac{i-0.5}{n}$ 分位点
- 所以称点集 $(u_i, x_{(i)})(i=1,2,...,n)$ 为分位数-分位数(Q-Q)图
- ,n个点应该近似分布在 $x = \sigma u + \mu$ 的直线上。此时样本来自 正态总体的假设成立;否则不成立。

- (2) 步骤

• 将样本数据从小到大排列,得次序统计量: $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq ... \leq x_{(n)}$,求事件{ $X \leq x_{(i)}$ }的概率 p_i (i=1,2,...,n)

$$p_i = F_n(x_{(i)}) = \frac{i - 0.5}{n}$$

- 对 p_i 计算相应的标准正态分位数 u_i (i=1,2,...,n)
- 把点 $(u_i, x_{(i)})(i=1,2,...,n)$ 画在平面坐标系上,并考察他们是否在一条直线上;
- 计算相关系数 r, 并检验其正态性

$$r = \frac{\sum (x_{(i)} - \overline{x})(u_i - \overline{u})}{\sqrt{\sum (x_{(i)} - \overline{x})^2} \sqrt{\sum (u_i - \overline{u})^2}}$$

